**文章编号**: 100124322(2004)1221558205

# 滤片2XRD 探测系统响应时间测量<sup>^</sup>

孙可煦, 江少恩, 易荣清, 黄翼翔, 崔延莉, 李朝光

(中国工程物理研究院 激光聚变研究中心,四川 绵阳 621900)

摘 要: 研究了软 X 射线能谱仪探测道系统(系统包括 X 射线二极管(XRD)、SUJ250210 电缆和不同频 带示波器)的响应时间。实验利用上海激光联合实验室的 20 TW 激光器激光(激光能量约 20J,脉冲宽度约 1ps)打金箔靶产生的 X 光,用 XRD 探测系统测量,记录示波器有 T K684C,T K694C 和 WM8500 等。将实验数 据进行了线性拟合和比对分析。滤片2XRD 探测系统的响应时间随偏压升高而加快,随传输电缆长度的增加 而变慢,因此测量快信号过程时,应提高探测器偏压,缩短传输电缆,选择宽频带高采样率示波器,以便减少系统的响应时间,减小信号失真程度。

**关键词**: 软 X 射线; 能谱; X 射线二极管; 响应时间 中图分类号: TN151.1 **文献标识码**: A

ICF 实验研究中,激光等离子体发射软 X 光的时、空、谱测量极其重要<sup>[1,2]</sup>,除了能谱绝对强度测量十分重 要外,能谱发射的时间过程也十分重要。随着激光器升级完成,通过多路激光注入腔靶或辐照其它形式靶,可 以产生高强度的 X 光。利用这种高强度的 X 光辐射源,为深入开展辐射输运、辐射烧蚀及辐射不透明度等一 系列的应用研究提供了可能性。在这一系列的应用研究中,辐射场的变化过程,始终是我们十分感兴趣的。我 们除了关心辐射场的空间分布外,更离不开辐射场变化的时间过程<sup>[3,4]</sup>。

能谱测量,目前滤波法能谱仪(滤片2X 射线二极管(XRD)阵列谱仪)<sup>[5]</sup>仍具有不可代替的作用。XRD 虽 然具有响应时间快,便于作能量响应灵敏度绝对标定等优点。但是,迄今为止,我们对 XRD 的时间响应特性还 没有做过系统的研究,因此,XRD 系统响应时间研究也是我们近期工作的重要内容。

#### 1 实验条件

实验利用上海激光联合实验室 20 TW 激光器激光(激 光能量 1~2J,脉冲宽度约 1ps),打金箔靶,靶室真空度约 2 ×10<sup>-3</sup> Pa。被测探测器有 X射线二极管(XRD)和光电导 探测器(GaAs)等。信号传输电缆为 SUJ25027 高频电缆, 记录示波器有 TK684C,TK694C 和 WM8500 等。实验装 置如图 1 所示。

#### 2 实验结果

上海激光联合实验室的 20TW 激光器是刚建成的,缺 少脉冲监测设备,打靶参数不能实时监测。20TW 激光器 脉冲宽度号称 1ps,实际脉冲形状并不清楚。但是,这个量 级的脉冲波形,即使偏差大一些,对我们这个实验的 XRD



响应时间测量(上百 ps),也不会有太大影响。因此,对于待测系统而言,X 光脉冲波形可看作 函数形式。 实验中,XRD 偏压 1~5kV,TK684C,TK694C和 WM8500 三种示波器测量到的脉冲波形参见图 2。图 2 (a)为 XRD 在不同偏压下三种示波器测量到的脉冲波形;图 2(b)为滤片2XRD2694C系统在 5kV 偏压和不同电 缆长度下的测量脉冲波形。

X 收稿日期:2004204207; 修订日期:2004207220 基金项目:国家 863 计划项目资助课题 作者简介:孙可煦(1941 →),男,研究员,主要从事激光2等离子体实验诊断工作;绵阳市 9192986 信箱。

© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.



Fig. 2 (a) Pulse waveform for three filter2X2ray diode(XRD) systems with 22m cable;
(b) Pulse waveform of filter2XRD TK694C system with different cable length
图 2 (a) 不同偏压下,三种滤片2XRD2示波器探测系统记录脉冲波形;
(b)滤片2XRD2694C 系统在不同电缆长度下的测量脉冲波形

### 3 数据分析和讨论

根据实验测量结果(如图 2),读出不同示波器测量脉冲波形的前沿和半宽度,从而给出不同示波器探测系统响应时间随 XRD 偏压变化值。下面我们分别讨论三种不同示波器探测系统测量结果。

#### 3.1 滤片2XRD2TK684C系统响应时间

滤片2XRD2TK684C系统响应时间测量值列于表 1 中,由表 1 数据可见, TK684C探测系统响应前沿在 300 ~ 320ps 之间,响应半宽度在 440 ~ 460ps 之间,这基本反映了该系统的频带特性。该系统中, XRD 和 SUJ 电缆的频率特性相对较快,它们对系统的响应时间贡献相对较小。粗略估算, XRD 的响应时间约 100ps, 22m SUJ2 50 电缆的响应时间小于 50ps,而 TK684C示波器的频带宽度为 1 000MHz,根据经验公式,其前沿响应时间应为 350ps,因此,该系统响应时间主要贡献者应是 TK684C示波器。实际测量结果表明, TK684C示波器的频带宽度好于 1 000MHz,其前沿响应小于 300ps。

_				front time			half width	
XRD	voltage/ V	energy/J	exp. value/ ps	linear fit/ps	relative error/ %	exp. value/ ps	linear fit/ps	relative error/ %
N06	1 000	1.55	310	321	3.4	460	457	0.7
N06	2 000	1.01	307	312	1.6	454	454	0
N06	3 000	1.37	326	303	7.5	440	452	2.7
N06	4 000	1.10	305	294	3.1	462	450	1.8
N06	5 000	1.10	265	285	4.2	444	447	0.7

表 1 滤片2XRD(N06)2684C系统响应时间测量值与拟合值(系统电缆长 22m) Table 1 Experiment value and linearity fit of response time for filter2XRD(N06)2684C system( cable length 22m)

由表 1 中测量数据可见,总的趋势是系统响应时间随 XRD 偏压增加而变快(参见图 3)。如果我们对测量 值进行线性拟合,再从测量值与拟合值的相对偏差可见,前沿测量值相对偏离拟合线小于 7.5 %,而半宽度测 量值相对偏离拟合线小于 2.7 %。为什么会出现这种现象呢?分析认为这是示波器采样率不够造成的。 TK684C 示波器的采样率为 5 GHz,也即每间隔 200ps 采样 1 个点,对于我们的被测系统而言,系统前沿响应时 间仅 300ps 左右,仅能采样 1~2 个点,必然存在较大的测量误差。系统半宽度响应时间为 450ps 左右,可采样





2~3个点,因此,它的测量值相对误差小于前沿的测量值的相对误差。

#### 3.2 滤片2XRD2TK694C系统响应时间

滤片2XRD2TK694C系统响应时间测量值列于表 2 和图 4 中。由表 2 可见,响应前沿在 150~180ps之间 和响应半宽度在 410~420ps 之间,这也基本反映了该系统的频带特性。根据响应前沿初步估算,该系统中, XRD 的响应时间约 100ps, 22m 长 SUJ250 电缆的响应时间小于 50ps,而 TK694C 示波器的频带宽度为 3 GHz, 它的自身响应时间约为 120ps,因此,在该系统中, T K694C 示波器的响应时间已不占主导作用,而是与 XRD 响应时间有同量级贡献。

Table 2 Experiment value and linear fit of response time for filter2 XRD(1102)2694C system (cable length 22m)								<b>m</b> )
				front time			half width	
XRD	voltage/ V	energy/J	exp. value/ ps	linear fit/ps	relative error/ %	exp.value/ps	linear fit/ps	relative error/ %
1102	1 000	1.1	176	176	0	415	416.2	0.2
1102	2 000	1.0	168	167	0.6	415	414.2	0.2
1102	3 000	1.0	157	158	0.6	414	411.5	0.6
1102	4 000	0.9	149	149	0	408	409.5	0.4
	front nulce signal / no	(a) (a) (a) (b) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	00 2000 3 voltage /	exp. value linear fit	d the function of the signal (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	000 2 000 1	o exp. value — linear fit 	
			voltage / '	v		volta	ge/V	

表 2 滤片2XRD(1102)2694C系统响应时间测量值与拟合值(系统电缆长 22m)



表 2 中还给出了系统响应时间的线性拟合值,由表中列出的测量值与拟合值的相对误差可见, T K694C 系 统响应时间测量值的相对误差远小于 T K684C 系统响应时间测量值的相对误差。这首先是因为 T K694C 示波 器的采样率为 10 GHz ,远高于 T K684C 示波器采样率 ,其次说明 T K694C 示波器的稳定性非常好。

#### 3.3 滤片2XRD2WM8500 系统响应时间

滤片2XRD2WM8500系统响应时间测量值列于表 3 和图 5 中,由表中数据可见,响应前沿在 140~170ps之 间和响应半宽度在 220~250ps 之间,这与该系统各个探测元件的频率特性也是基本吻合的。初步估算表明, 该系统中, XRD 的响应时间约为 100ps, 22m 长 SUJ250 电缆的响应时间小于 50ps, 而 WM8500 示波器的响应 时间为 70ps,因此,该系统前沿响应时间主要贡献者应是 XRD 探测器。其实该系统中, XRD 探测器和 WM8500 示波器的响应前沿仍属同量级 .只是 XRD 对系统的前沿响应时间的贡献略大干 WM8500 示波器的。 表 3 滤片2XRD(N06)2WM8500 系统响应时间测量值和拟合值(系统电缆长 22m)

	front time			half width				
XRD	voltage/ V	energy/J	exp. value/ ps	linear fit/ps	relative error/ %	exp. value/ ps	linear fit/ps	relative error/ %
N06	1 000	1.55	180	170	5.9	255	250	2.0
N06	2 000	1.01	150	162	7.4	245	243	0.8
N06	3 000	1.37	150	153	2.0	225	236	4.7
N06	4 000	1.10	145	145	0	225	229	1.7
N06	5 000	1.10	140	136	2.9	230	222	3.6

表 3 中还给出了滤片2XRD2WM8500 系统响应时间的线性拟合值 ,由表中列出的测量值与拟合值的相对 误差可见 .WM8500 探测系统响应时间测量值的相对误差与 TK684C 探测系统响应时间测量值的相对误差差 不多。虽然 WM8500 示波器的采样率为 20 GHz,远高于 TK684C 示波器采样率(5 GHz),由于 WM8500 是双 通道同时使用,对于一个探测系统而言,也仅为10 GHz的采样率,而WM8500示波器的频带宽度为5 GHz, 因此,该探测系统的响应时间快,采样点仍然显得有限,从而显示测量值相对涨落大。



Fig. 5 Front (a) and half width (b) of pulse signal for XRD(N06) + 22m cable + WM8500 system vs voltage
 图 5 XRD(N06) + 22m 电缆 + WM8500 系统的响应前沿(a) 和半宽度(b)线性拟合曲线

#### 3.4 电缆对 XRD 探测系统响应时间的影响

在 XRD 探测系统中,电缆也是影响该系统响应时间的重要因素之一。实验中,我们还做了响应时间随电 缆长度的变化(参见图 2(b)),图 6 给出 XRD2示波器系统在 5 000V 偏压下随电缆长度变化曲线。图 6(a)还 给出 XRD2T K694C 探测系统响应时间的线性拟合,线性拟合公式为

$$t_{\rm f} = 165 + 0.9L \tag{1}$$

$$t_{\rm w} = 344 + 5.3L \tag{2}$$

式中: $t_f$ 为系统前沿响应时间(ps); $t_w$ 为系统半宽度响应时间(ps);L为电缆长度(m)。



Fig. 6 Response time of filter2XRD2oscillograph system vs cable length with 5000V partial voltage
 图 6 滤片2XRD2示波器系统在 5 000 V 偏压下响应时间随电缆长度变化

根据 SUJ250 电缆手册标称值衰减系数(参见表 4),线性拟合后,SUJ250 电缆衰减系数 为

 $= 0.005 349 F^{0.5383}$ 

Frequency attenuation coefficient of SUD50 cable

式中: F为信号特性频率,单位为 MHz; 单位为 dB·m<sup>-1</sup>。

Table 4

表4 SUJ250目	<b>も缆频率衰减系数</b>
------------	-----------------

more i frequency attenuation confiction of 50220 table							
frequency/MHz	30	200	1 000	3 000	6 000		
handbook sign/ (dB m <sup>-1</sup> )	0.036	0.082	0.21	0.41	0.59		

根据文献[6],电缆响应时间为

$$= (0.115L)^2/4 f$$

式中: 是电缆响应时间(ns); *L* 是电缆长度(km); 是电缆衰减系数(dB/km); *f* 是信号频率(Hz)。计算结果 列于表 5 中,与测量结果还是比较接近的。

Table 5         Calculation value of SUJ250 cable response time							
cable length/ m	(1 GHz) / ps	(3 GHz) / ps	(6 GHz) / ps	(1 THz) / ps			
2	0.2	0.24	0.24	0.35			
12	6.7	8.5	8.8	12.5			
22	22.5	28.5	29.5	42.0			
32	47.5	60.4	62.5	88.9			

表 5 SUI250 电缆响应时间计算值

© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.

(3)

(4)

#### 4 结 论

滤片2XRD 探测系统的响应时间与 XRD 所加偏压密切相关,系统响应时间随偏压升高而加快,尤其当我 们用高带宽示波器观测时,由于示波器自身响应时间接近或小于 XRD 的响应时间,这种关系便更明显地表现 出来。当示波器频带较低时,由于示波器自身响应时间远大于 XRD 的响应时间,系统的响应时间变化便很难 体现出来。滤片2XRD 探测系统的响应时间还与信号传输电缆的长度密切相关,随着传输电缆长度增加,系统 响应时间变慢。因此,当我们作时间过程研究时,尤其是作快信号测量时,应适当提高探测器的偏压,缩短传输 电缆,选择宽频带高采样率示波器,以便提高系统的响应时间,减少信号的失真程度。

由于实验时间限制,实验重复不够,实验数据有限,因此,实验数据涨落较大,有待进一步实验,增加实验数 据,提高数据可信度。

致谢 实验得到上海激光联合实验室的领导和 20 TW 激光器运行组的工作人员谢兴龙、刘凤翘、管富义、黄关龙等同志的大力支持和帮助,在此 表示衷心感谢!

#### 参考文献:

- [1] 常铁强,贺贤土,于敏.高增益间接驱动惯性约束聚变物理过程[J].强激光与粒子束,1989,1(3):193-209.(Chang T Q, He X T, Yu M. Pysics process of the indirect2drive in inertial confinement fusion with high gain. *High Power Laser and Particle Beams*, 1989,1(3):193-209)
- [2] 张钧,裴文兵,隋成之,等. 激光柱型腔靶 X 射线温度和 X 射线转换效率 [J]. 物理学报, 1991, 40(3):424-432. (Zhang J, Pei W B, Sui C Z et al. Radiation temperature and X2ray conversion efficiancy for laser2cavity target. Acta Physica Sinica, 1991, 40(3):424-432)
- [3] 孙可煦,易荣清,马洪亮,等. 激光腔靶辐射时间特性研究 [J]. 光学学报, 1994, 14(6):561-567. (Sun KX, Yi RQ, Ma HL, et al. Radiation time property for cavity target heated by laser. *Acta Optica Sinica*, 1994, 14(6):561-567)
- [4] 孙可煦,易荣清,黄天暄,等.辐射加热金等离子体再发射时间测量[J].强激光与粒子束,1997,9(4):543-546. (Sun K X, Yi R Q, Huang T X, et al. X2ray reemission time measurement from gold material heated by radiation. *High Power Laser and Particle Beams*, 1997,9(4):543-546)
- [5] 孙可煦,杨建国,郑志坚.用于激光等离子体诊断的亚千 X 射线能谱仪[J].强激光与粒子束,1990,2(1):16—22. (Sun K X, Yang J G, Zheng ZJ. A subkeV X2ray spectrometer used in laser plasma interaction experiments. *High Power Laser and Particle Beams*, 1990,2(1):16—22)
- [6] 刘庆兆. 脉冲辐射场诊断技术[M]. 北京:科学出版社,1994.232—290. (Liu Q Z. Diagnostics technique of pulse radiation field. Beijing: Science Press,1994.232—290)

## Response time measurement for a filter2 X2ray diode detection system

SUN Ke2xu, JIANG Shao2en, YI Rong2qing, HUANG Yi2xiang, CUI Yan2li, LI Chao2guang (Research Center of Laser Fusion, CAEP, P. O. Box 9192986, Mianyang 621900, China)

**Abstract :** The detection system consists of filter ,XRD ,SUJ250210 cable and different band oscillograph. 20 TW laser facility of Shanghai Laser Unite Laboratory with energy about 20J ,pulse width about 1ps was used , and Au foil target irradiated by laser pulse pro2 duced X2ray emission. Note oscillograph type have TK684C,TK694C and WM8500. The linear fit and comparision analysis of experi2 ment data are proceeded. The response time of a filter2XRD detection system become fast along with based voltage , and become solw a2 long with cable lenght. Therefor , when fast signal is measured , based voltage of detector must be increased , and cable length be short2 en , and high band oscillograph be selected , in order to reduce system response time and decrease signal distortion.

Key words: Soft X2ray; Energy spectrum; X2ray diode; Response time